

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN / CALIBRATION CERTIFICATE

INNOVATECIS CIA. LTDA.

JOSE MARIA GUERRERO N69-170 Y ALFONSO DEL HIERRO

QUITO, ECUADOR

(+593) 02 6040 607

innovatec@innovatec.com.ec

Certificado No. (Certificate #): 55066

Fecha de Recepción (Reception Date): 2025-03-18

Fecha de Calibración (Calibration Date): 2025-03-18

Próxima Fecha de Calibración (Calibration Due): 2026-03

Fecha de Emisión (Emission Date): 2025-03-24

Cliente (Client): EMPAQPLAST S.A.
Via Amaguana Km 2 1/2, SANGOLQUI, PICHINCHA

Información del Instrumento (Instrument Information)

Equipo (Instrument):	Medidor de Espesores	Ubicación (Location):	LABORATORIO DE CALIDAD	Int. de Medición: (0 a 1000) μm
Marca (Brand):	OLYMPUS	Código (Code):	LDD2-001	(Measurement Range)
Modelo (Model):	MAGNA MIKE 8600	Lugar de Calibración (Place of Calibration):	In Situ	División de escala: 0.001 μm
Serie (Serial #):	150181001			(Resolution)

Datos de Calibración (Calibration Info)	Condiciones Ambientales (Environmental Conditions)
Procedimiento (Procedure): INN-PC-31 Por Comparación.	Temp. Inicial (Initial Temp.): 21.3 °C
	Temp. Final (Final Temp.): 23.2 °C
	Hum. Inicial (Initial Hum.): 56.8 %HR
	Hum. Final (Final Hum.): 54.7 %HR

Trazabilidad (Traceability Info)

Patrón (Standard)	Marca (Brand)	Cert. #	Ultima Calibración (Last Cal.)	Período (Period)
Thickness Standard Elcometer	ELCOMETER	US011-MKE-CI-25049486	2025-02-06	2 Años

Resultados (Results)

Ver Resultados en Hoja Adjuntada

See results in attached Sheet

El presente Certificado de Calibración posee la trazabilidad en esta magnitud hacia el Patrón Nacional, a través de la realización de la unidad de medida en el NPL, NIST, u otro Laboratorio Nacional reconocido al Sistema Internacional de Medidas. La calibración fue realizada bajo un Sistema de Gestión de Laboratorio conforme a la Norma ISO/IEC 17025:2017. Los resultados y su incertidumbre reportada con un nivel de confianza de $k=2$, 95% son relacionados a este instrumento y en el tiempo que se realizó las medidas. Este Laboratorio no se responsabiliza de los perjuicios que pueda ocasionar el uso inadecuado del instrumento calibrado. La reproducción parcial es prohibida, la reproducción total deberá hacerse con la autorización escrita aprobada por INNOVATEC Industrial Solutions. This Certificate of Calibration provides traceability of measurement to the National Standard, through units of measurement realized at the NPL, NIST or other recognized National Standard Laboratories to the International System of Units. The calibration was performed under a Laboratory Management System in accordance with the ISO/IEC 17025:2017 Standard. The results and the reported uncertainty at a confidence level of $k=2$, 95% are related only to this instrument and at the time of measurement. This Laboratory is not responsible for any damages that may result from improper use of the calibrated instrument. Partial reproduction is forbidden, the total reproduction must have an approved written authorization by INNOVATEC Industrial Solutions.

Comentarios:

(Comments):

Calibrado por: Patricio Junior Llerena Carvajal
(Calibrated by):

Aprobado por:
(Approved by):

Fin de Certificado (End of Certificate)

Patrón (Standard)		UBP (UUT)	Error (Error)	E.M.P (Tolerance)	Incertidumbre (Uncertainty)	
23.3 μm		21 μm	-2.30 μm	± 3 μm	±	5.8E-01 μm
51.6 μm		50 μm	-1.60 μm	± 3 μm	±	5.8E-01 μm
124.6 μm		123 μm	-1.60 μm	± 3 μm	±	6.1E-01 μm
250.3 μm		249 μm	-1.30 μm	± 3 μm	±	6.9E-01 μm
486.0 μm		485 μm	-1.00 μm	± 3 μm	±	9.4E-01 μm
963.0 μm		962 μm	-1.00 μm	± 3 μm	±	1.6E+00 μm

Patrón (Standard)		UBP (UUT)	Error (Error)	E.M.P (Tolerance)	Incertidumbre (Uncertainty)	
DISCO 0.253 mm	0.255 mm	0.253 mm	-0.002 mm	± 3 μm	±	6.9E-01 μm
DISCO 0.479 mm	0.481 mm	0.479 mm	-0.002 mm	± 3 μm	±	9.4E-01 μm
DISCO 1.011 mm	1.014 mm	1.011 mm	-0.003 mm	± 3 μm	±	1.6E+00 μm
DISCO 2.032 mm	2.035 mm	2.032 mm	-0.003 mm	± 3 μm	±	1.6E+00 μm
DISCO 4.064 mm	4.066 mm	4.064 mm	-0.002 mm	± 3 μm	±	1.6E+00 μm
DISCO 6.100 mm	6.103 mm	6.100 mm	-0.003 mm	± 3 μm	±	1.6E+00 μm
DISCO 9.150 mm	9.152 mm	9.150 mm	-0.002 mm	± 3 μm	±	1.6E+00 μm